

《大学物理实验》

实验报告

 班级:
 计203

 学号:
 20002462

 姓名:
 刘子言

 指导教师:
 倪一

信息科学与工程学院 2022 年 3 月

实验名称: v射线能谱测量及其在材料改性中的应用

姓名: 刘子言 学号: 20002462 实验班: G13 组号: 15 教师: 倪一

一、实验目的与要求

- 1、测量 60 Co 和 137 Cs 的 γ 能谱,并进行能量刻度和能量重建。
- 2、画出以能量为横坐标的 60 Co 和 137 Cs 的 γ 能谱图。指出 γ 能谱的特征结构。
- **3**、测量辐照后宝石的 γ 能谱,在同样测量条件下测量环境的 γ 能谱。比较两者,并据此判断辐照宝石同环境相比有无明显放射性。

二、实验原理

1、基本概念

- (1) 放射性: 也称核辐射, 是指不稳定原子核发射粒子的现象。常见的辐射类型包括 α 、 β 、 γ 辐射。
- (2) γ射线: 是一种电磁辐射,通常产生于原子核的衰变、核反应、闪电等。在宇宙中,中 子星、脉冲星、超新星爆发、黑洞附近以及活动星系核等也可以产生γ射线。γ射线具 有很强的穿透能力,在超过一定照射剂量时,是一种具有危险性的辐射。
- (3) γ射线与物质的相互作用包括:
 - 光电效应(主导能区: <50KeV)
 - 康普顿散射(主导能区: 100KeV~10MeV)
 - 电子对效应(主导能区: >5MeV)
- (4) γ放射源的能谱: 是放射源发射的粒子在不同能量上的计数的统计。
 - 能谱的测量:确定每个粒子的能量;统计每个能量上的粒子数目。
- (5) 放射源发射的 y 光子是单能的,常见的 γ 放射源有:
 - ¹³⁷Cs: γ 光子的主要能量为 0.662MeV
 - ⁶⁰Co: γ 光子的主要能量位 1.173MeV, 1.332MeV
- (6) 能谱的主要特征: 反散射峰、康普顿边、全能峰。
 - 全能峰: 放射源的单能 γ 射线能量全部沉积在探测器中的情况概率最大, 计数最多, 在能谱图上就会对应的形成一个峰。
 - 康普顿边: ⁶⁰Co 和 ¹³⁷Cs 的 γ 射线能量在 100KeV-10MeV 之间,与探测物质的作用以 康普顿散射为主;康普顿散射的反冲电子能量是散射角 θ 的函数,是连续分 布的;在散射角等于 0 度时,反冲电子获得最大动能,对应的能量截断结构 称为康普顿边。

2、γ粒子能量探测原理

- (1) 闪烁体探测器探测原理:
 - 粒子打进闪烁体, 使闪烁体分子激发或电离, 损失全部或部分能量;
 - •受激原子或分子退激发射可见光范围光子;
 - 光子经过反射层和光导, 大部分打到 PMT 光阴极上;
 - PMT 放大光信号形成电流脉冲,经过后级电路成为电压脉冲;
 - PMT 脉冲经过放大后进入多道分析器。
- (2) 光电倍增管原理:

可见光光子在光阴极产生光电效应; 打拿极雪崩放大光电子形成电流; 最终产生的一个电压脉冲对应一个 γ 光子, 其幅度正比于伽马光子的能量, 原因如下:

由于: 闪烁体产生的光子数 正比于 粒子能量 输出脉冲幅度 正比于 闪烁体产生的光子数

所以:输出脉冲幅度 正比于 粒子能量

(3) 多道分析器:

本质上是一个模-数转换器,本实验中用于测量统计得到的脉冲幅度。

- (4) 能量刻度与能量重建:
 - 60Co 通过两个全能峰对应的能量和通道数来绘制能量刻度;
 - 137Cs 通过坐标原点和一个全能峰对应的能量与通道数来绘制能量刻度。
 - •利用刻度的关系画获得能量为横坐标的过程为能量重建,最终得到能谱图(计数-能量)。

3、宝石辐照原理

- ——γ射线材料改性
- (1) 宝石的颜色:
 - 宝石颜色来源于色心(晶体中对可见光产生选择性吸收的缺陷部位)。
 - •辐照可以使晶体的晶格产生缺陷,改变宝石的色心。光照射到有缺陷的晶体时,就会 呈现与原来不同的颜色。
- (2) 经辐照宝石的安全性:

是否安全,是否有残留放射性,都需要利用γ射线的能谱测量来确定。

三、实验仪器

闪烁体探测器,放大器,多道脉冲分析器,高压电源,NIM 机箱,放射源(60Co、137Cs、宝石)、示波器、计算机、导线若干

四、实验操作步骤

本次实验基于虚拟实验室完成。

1、准备工作:

- 首先进入实验室, 打开右侧墙壁上的环境监测仪;
- •来到实验台前,检查桌面上已有的设备;
- 前往储物柜,取出闪烁体探测器、放大器、多道脉冲分析器和高压电源,回到实验台前,将闪烁体探测器放置于桌面,将放大器、多道脉冲分析器和高压电源以此放入 NIM 机箱中;
- •正确连接电路,确认无误后再打开机箱开关、示波器开关和计算机开关,将计算机调 至测量界面;

2、测量 ¹³⁷Cs 的 γ 能谱

- (1) 取数前:
 - 前往放射源保险柜取出放射源 ¹³⁷Cs, 关好柜门, 并在使用卡上登记相关信息;
 - •回到实验台,将¹³⁷Cs 放入闪烁体探测器;将高压电源 PV 值调至 900V,并将高压电源 开关打开:
 - 适当调高放大器的增益倍数,再调节示波器,根据示波器上脉冲的显示情况再来适当调节放大器的增益倍数,使示波器上显示较为清晰的脉冲信号;
 - 在计算机测量界面设定正确的通道(CH3),道数(1024),脉冲阈值(50mV);
 - 计算取数时间: 已知 γ 射线进入到闪烁体中的事例率为 1665Hz, 探测器的总探测效率为 60%, 如果要取百万数量级的 γ 事例, 取数时间至少设为: (10⁶/1665)/0.6 s;
- (2) 取数时:

• 测量:点击运行按钮(run),若测量图中发现图像较为偏左,则停止测量,适当调大放大器增益倍数,再测量;若偏右而超出坐标轴,则调小增益倍数;等待,完成后将数据保存在电脑上;

(3) 取数后:

- 关闭高压电源开关,再将 ¹³⁷Cs 取出,放回放射源保险柜,并在使用卡上登记相关信息;
- •回到实验台,打开高压电源开关,保持所有条件不变重复测量操作,测量环境中γ射线的能谱,并保存数据,结束后及时关闭高压电源开关。

3、测量 60Co 的 γ 能谱

- 前往放射源保险柜取出放射源 60Co, 关好柜门, 并在使用卡上登记相关信息;
- •重复测量 137 Cs γ 能谱时的相关步骤,注意每次打开闪烁体探测器时要保证高压电源处于关闭状态;
- 将数据保存在电脑上; 并及时归还放射源, 做好登记。

4、测量辐照后宝石的γ能谱

- 前往储物柜取出宝石,前往辐照室,将宝石放入桶中,送入内室辐照 60 天,再取出。 注意辐照过程人员应当离开辐照室,且注意进出一定要关门;
- •将宝石带到实验台,重复测量 ¹³⁷Cs γ 能谱时的相关步骤,将数据保存在电脑上;注意 每次打开闪烁体探测器时要保证高压电源处于关闭状态;再将宝石放回储物柜;
- 再打开高压电源开关,保持所有条件不变重复测量操作,测量环境中γ射线的能谱, 并保存数据,结束后及时关闭高压电源开关。

5、收尾工作

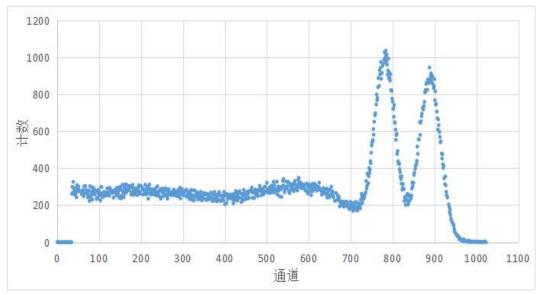
- 将所有电源开关关闭, 收回导线和各仪器, 放回储物柜中;
- 检查放射源保险柜中的放射源是否归还到位,并将放射源储物间门关闭锁上;
- 检查实验台是否整理完毕,关闭环境监测仪,结束实验。

五、数据记录与处理

1、绘制 60Co 的 γ 能谱图

• 计数-通道图

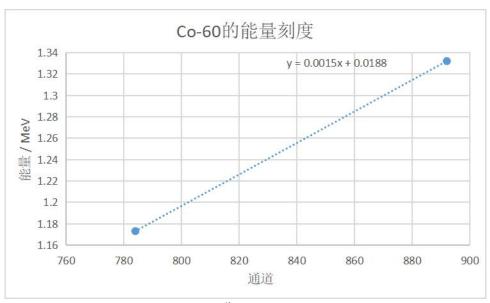
将 60Co 保存的表格数据绘制成计数-通道图,如图一;



图一 60Co 计数-通道图

• 能量刻度

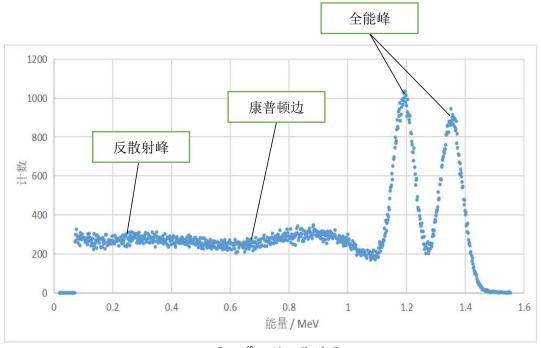
从计数-通道图中读出两个全能峰的能量中心值,通道数分别为 784 (对应能量为 1.173MeV) 和 892 (对应能量为 1.332MeV);以此绘制 ⁶⁰Co 的能量刻度,如图二;



图二 60Co 的能量刻度

γ能谱图

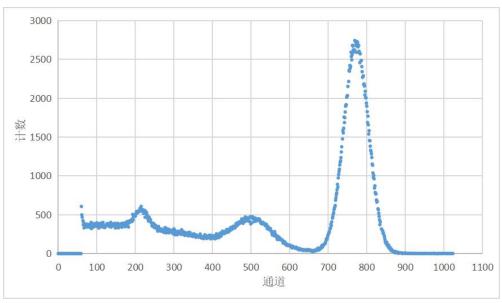
在能量刻度图中得到通道-能量的线性关系式,利用公式在表格中计算相应通道对应的能量值,再绘制计数与能量的关系图,即 60 Co 的 γ 能谱图,如图三;



图三 ⁶⁰Co 的γ能谱图

2、绘制 137 Cs 的 γ 能谱图

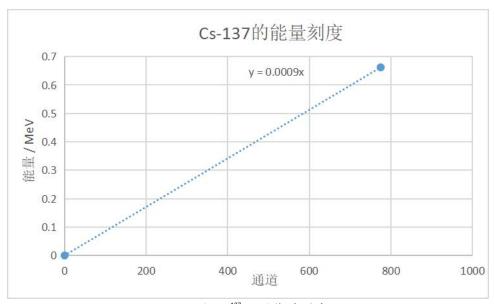
• 计数-通道图 绘制过程与 60Co 类似,如图四;



图四 137Cs 计数-通道图

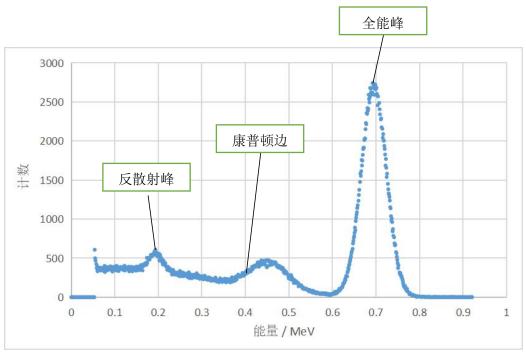
• 能量刻度

绘制能量刻度时,从计数-通道图中读出一个全能峰的能量中心值为 775 (对应能量为 0.662MeV),与(0,0)点相连绘制能量刻度,如图五;



图五 137Cs 的能量刻度

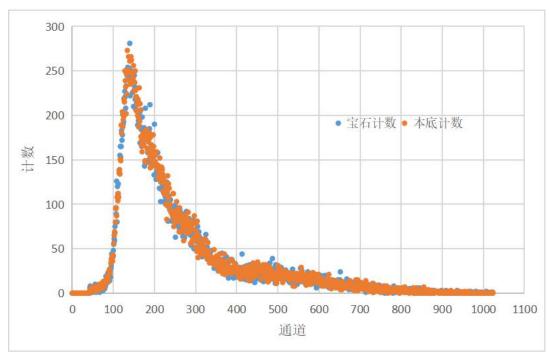
γ能谱图
 绘制过程与 ⁶⁰Co 类似,如图六;



图六 137Cs 的γ能谱图

3、辐照后宝石放射性鉴定

• γ 能谱 将环境测量数据与宝石数据放入同一张表格中,绘制 γ 能谱图,如图七;



图七 宝石与环境的γ能谱

• 比较放射性

由图像可先大致看出,辐照后宝石的γ能谱与环境的γ能谱相当。 对计数求总和,下面计算相对偏差:

$$\epsilon = \frac{|宝石总计数 - 环境总计数|}{$$
环境总计数 $} \times 100\% = \frac{|38261 - 38505|}{38505} \times 100\% \approx 0.6\%$

由此可见,实验中辐照后的宝石与环境相比较基本没有明显的放射性。

六、结果与讨论

- 1、60Co 与 ¹³⁷Cs 经过能量重建后的 γ 能谱图见图三与图六,图中已标出其特征结构。
- 2、辐照后的宝石和环境的γ能谱图如图七,结合图像,再经过计算,得到宝石与环境总计数的相对偏差为 0.6%,可以得出结论,实验中所辐照的宝石辐照后与环境相比较,基本没有明显的放射性。

七、分析讨论题

- 1. 请思考以下电子学插件的参数设置会对能谱产生什么影响?在讨论其中一个参数时,请固定其他两个进行讨论。
 - ①放大器的放大倍数
 - ②多道分析器的总道数
 - ③取数的时间

答:分析如下:

- 多道分析器是测量并记录脉冲数目的器件,具有最大量程电压 U。
- 多道分析器取数时可以选择总道数 n,例如 512 道,1024 道,2048 道等,每一道所分的电压就是 Umax/n。
- •如果接收的信号脉冲是电压是 Usignal,那么信号到达的道数是 Usignal/(Umax/n)。
- •如果对信号放大 k 倍, 信号的脉冲电压幅度就变成 kUsignal, 信号到达的道数就是 kUsignal/(Umax/n)。
- •多道分析器会累计到达每个通道的信号的个数,取数完毕之后,就给出了信号的计数每个通道的分布,将量程电压等分成 n 个格子,统计落到不同电压格子的信号数目。
- (1) 放大器的放大倍数 k 影响: 当总道数和取数时间不变时,放大器的放大倍数 k 越大,能谱的横坐标越大,纵坐标越小。

由于:

- a. 放大器放大倍数 正比于 信号脉冲高度 正比于 信号在多道中达到的道数(信号对应的能谱横坐标的通道位置);
- b. 多道分析器是对粒子计数的仪器;

则对应的有以下结论:

- a. 如果信号脉冲高度放大 n 倍,信号对应的通道数也会放大 n 倍,因此能谱的横坐标就会放大 n 倍;
- b. 无论放大多少倍,多道分析器看到的粒子总数目(能谱的面积)不会变化。所以当能谱的横坐标放大 n 倍时,能谱的纵坐标就会缩小,以保证能谱总面积不变。
- (2) 多道分析器的总道数 n 影响: 当放大倍数和取数时间不变时,总道数 n 变大,能谱的横坐标会变大,纵坐标会变小。

- 结合多道分析器的工作原理,多道分析器的总道数增大,不会使峰在整个量程的相对 位置发生变化;而因为入射粒子总计数不会变化,多道的总道数若增大,每个通道分 得的粒子计数就会减少,因此能谱的纵坐标就会减小。
- (3) 取数时间影响: 当放大倍数和总道数不变时,取数时间越长,取得的事例数就越多,能谱谱线也会越光滑(越密集),能谱的高度会增大(纵坐标会变大)。
- 2. 在比较辐照后的宝石和环境的放射性水平时, 我们强调需要在完全相同的测量条件下进行测量,才可以直接对两者进行比较。如果发生了以下测量条件不同的情况,应该怎么比较? 在讨论其中一个参数时,请固定其他两个进行讨论。
 - ①放大器的放大倍数不同:宝石测量放大倍数为 A,环境测量放大倍数为 B;
 - ②多道分析器的总道数不同:宝石测量总道数为 M,环境测量总道数为 N;
 - ③取数的时间不同:宝石测量取数时间为 T,环境测量取数时间为 K。

答:分析如下:

- 放射性水平,相当于放射性活度。在相同测量条件下测量两个物理量,可以对这两个量进行直接比较。如果测量条件不同,就要折算为相同条件才可以直接比较。
- (1)结合第1题的第(1)问,放大倍数不会影响粒子的总计数,放大倍数增大会使能谱的横坐标增大、纵坐标减小。
 - 将环境的能谱横坐标乘以 A/ B 倍, 纵坐标乘以 B/A 倍, 才能够统一比较。
- (2) 多道分析器总道数越多,每个道分到的事例数就越少,整个能谱的高度就越低,因此 能谱高度和多道分析器设定的总道数成反比关系。
 - 将环境的能谱横坐标乘以 M/N, 纵坐标乘以 N/M, 才能够统一比较。
- (3) 取数时间越长, 粒子计数越多。取数时间和能谱高度成正比关系。
 - 环境的能谱纵坐标乘以 T/K, 才能够统一比较。
- 3. 不同的材料对射线的阻挡能力不同。现在有两块材料 A 和 B 需要测试哪一种可以更有效的屏蔽射线。请利用本实验的探测器,设计实验测量方案并判断应该选择哪一种作为屏蔽材料。
- 答: 方案设计如下:

利用本实验中的 γ 射线能谱测量装置进行测量,实验步骤如下:

- (1) 数据测量:
 - •取材料 A 包装 ⁶⁰Co 放射源,再放入闪烁体探测器中,依据实验中的具体步骤,调节好相关参数,测量并记录γ射线穿过材料 A 后的能谱;
 - •再取材料 B 包装相同的 ⁶⁰Co 放射源, 放入闪烁体探测器中, 保持所有的条件参数不变, 重复测量步骤并记录能谱;
 - •将 ⁶⁰Co 放射源不加包装直接放入闪烁体探测器,重复测量步骤测量并记录其γ能谱;
 - 取出放射源,保持所有的条件参数不变,重复测量步骤来测量并记录环境中γ能谱;
- (2) 数据处理:将四个能谱图绘制在一张坐标图中;再进一步求出材料 A、B 下能谱总计数,分别与纯放射源能谱总计数做差值。
- (3)得出结论:以环境能谱和纯放射源能谱为基准,观察比较 A、B 能谱高度、峰值高度,若有一方明显较高,则这种材料对射线的屏蔽效果较差;再进一步来比较差值大小,差值越大,说明该材料的屏蔽效果越好,应选择这种屏蔽材料。